

# Pannes




Thème : Pannes

Origine : RAMEAU






Domaines : Technique

## Notices thématiques en relation (9 ressources dans data.bnf.fr)

### Termes plus larges (3)

Fiabilité		Ingénierie des systèmes	
Tolérance aux fautes (ingénierie)			

### Termes plus précis (5)







Chaudières à vapeur -- Pannes		Détection de défaut (ingénierie)	
Électricité -- Pannes		Systèmes informatiques -- Pannes	
Temps entre défaillances, Analyse des			











### Termes reliés (1)

Chômage technique	
-------------------	---






Documents sur ce thème (36 ressources dans data.bnf.fr)

Livres (28)

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>Invention and innovation</b> (2023) , Vaclav Smil, Cambridge, Massachusetts : The MIT press </p>   | <p><b>Fault diagnosis, prognosis, and reliability for electrical machines and drives</b> (2022) , Hoboken : Wiley ; [Piscataway] : IEEE press </p>            |
| <p><b>Forensic systems engineering</b> (2018) , William A. Stimson, Hoboken : Wiley </p>   | <p><b>Success through failure</b> (2018) , Henry Petroski, Princeton : Princeton university press , 2018 </p>   |
| <p><b>Reliability models of complex systems for robots and automation</b> (2017) , Seyed Taghi Akhavan Niaki, Hamed Fazlollahtabar, Boca Raton : CRC press , 2017 </p> | <p><b>Integrierte schadenanalyse</b> (2015) , Karlheinz G. Schmitt-Thomas, Berlin : Springer Vieweg , 2015 </p>   |
| <p><b>Dependability in electronic systems</b> (2011) , New York : Springer , 2011 </p>   | <p><b>Forensic engineering</b> (2009) , London : Th. Telford , cop. 2009 </p>   |
| <p><b>Responsibility and dependable systems</b> (2007) , London : Springer , cop. 2007 </p>  | <p><b>Fault-diagnosis systems</b> (2006) , Rolf Isermann, Berlin ; New York : Springer , cop. 2006 </p>   |
| <p><b>Investigation of aeronautical and engineering component failures</b> (2004) , A. Venugopal Reddy, Boca Raton, Fla. : CRC Press , cop. 2004 </p>                | <p><b>Fault diagnosis</b> (2004) , Berlin ; New York : Springer , cop. 2004 </p>  |
| <p><b>Fault diagnosis and fault tolerance for mechatronics systems</b> (2003) , Berlin : Springer , cop. 2003 </p>   | <p><b>Failure analysis case studies II</b> (2001) , Amsterdam ; New York : Pergamon , 2001 </p>   |
| <p><b>Power system restoration</b> (2000) , New York : Institute of electrical and electronics engineers , cop. 2000 </p>  | <p><b>Electronic failure analysis handbook</b> (1999) , Perry L. Martin, New York ; San Francisco ; Washington (D.C.) [etc.] : McGraw-Hill , cop. 1999 </p> |
| <p><b>Root cause failure analysis</b> (1999) , R. Keith Mobley, Boston : Newnes , 1999 </p>  | <p><b>Root cause failure analysis</b> (1999) , R. Keith Mobley, Boston : Newnes , cop. 1999 </p>  |

Reliability and failure of electronic materials and devices (1998)	, Milton Ohring, San Diego : Academic Press , cop. 1998		Solutions to equipment failures (1998)	, Peter F. Timmins, Materials Parks, OH : ASM International , 1998	
Forensic engineering (1998)	, Boca Raton ; Boston ; London [etc.] : CRC Press , cop. 1998		Réseaux d'interconnexion tolérant les pannes et analyse de signature en compression de données (1996)	, Shulin Qiu, Paris : École nationale supérieure des télécommunications , 1996	
Design paradigms (1994)	, Henry Petroski, Cambridge (Mass.) : Cambridge university press , 1994		Mechanical failure avoidance (1994)	, Charles E. Witherell, New York ; San Francisco ; Washington, D. C. [etc.] : McGraw-Hill , 1994	
Materials and processing failures in the electronics and computer industries (1993)	, A. S. Brar, Prativadi B. Narayan, Material park (Ohio) : ASM , 1993		Failure analysis in engineering applications (1992)	, Shin'ichi Nishida, [Oxford] : Butterworth-Heinemann , 1992, cop. 1986	
Failure analysis in engineering applications (1992)	, Shin-Ichi Nishida, Oxford ; Boston : Butterworth-Heinemann , 1992		Détection et diagnostic de pannes (1990)	, Paris : Hermès , 1990	

**Documents électroniques (5)**

Néodiag (2010)	, POS industry, Nanterre : POS industry , cop. 2010		Néodiag (2004)	, POS industry, Nanterre : POS industry , cop. 2004	
Néodiag (2004)	, POS industry, Nanterre : POS industry , cop. 2004		Néodiag (2004)	, POS industry, Nanterre : POS industry , cop. 2004	
Néodiag (2004)	, POS industry, Nanterre : POS industry , cop. 2004				

Images (3)

[Moyens de transport] (1945)	, Willy Ronis (1910-2009), [Paris] : [Agence de presse] , [1945-1966]	Automobile (191.)	, Donadini, Jr, [S.l.] : [s.n.] , 1910-1919
Automobilisme (190.)	, Fernand Fernel (1872?-1934?), [S.l.] : [s.n.] , 1900-1950		

Personnes ou collectivités en relation avec le thème: "Pannes" (20 ressources dans data.bnf.fr)

Auteur du texte (13)

A. S. Brar	Hamed Fazlollahtabar
Perry L. Martin	R. Keith Mobley
Prativadi B. Narayan	Seyed Taghi Akhavan Niaki
Shin'ichi Nishida	Henry Petroski
Shulin Qiu	A. Venugopal Reddy
Vaclav Smil	William A. Stimson
Charles E. Witherell	

Éditeur scientifique (5)

Mahmod M. Adibi (1924-2018)	Fabrizio Caccavale
Kenneth L. Carper	David R. H. Jones
Luigi Villani	

### Dessinateur (1)

Fernand Fernel (1872?-1934?)



### Réalisateur (1)

POS industry



**Voir aussi** (2 ressources dans data.bnf.fr)

### À la BnF (1)

Notice correspondante dans Catalogue général

### Sur le Web (1)

Notice correspondante dans Bibliothèque du Congrès